Традиционные методы изображения рентгеновскими лучами не всегда достаточно эффективны для обнаружения малых или низкоденситетных структур. Однако новый подход позволяет использовать рассеянный свет для создания изображений, в которых становятся видимы мельчайшие детали и структуры, не доступные для обычных методов.

Эта техника может даже делать видимыми структуры, находящиеся ниже разрешения обычного рентгеновского микроскопа, что делает ее важным инструментом для будущих исследований материалов и контроля качества.

Предложенный метод легко интегрируется в существующие рентгеновские микроскопы, что делает его доступным для применения в индустрии и академических исследованиях, улучшая возможности обнаружения дефектов и несовершенств в материалах.

Все права защищены